

摘要

无论使用的是哪一种分析技术，都必须坚持遵守正确的程序和制样过程。本文简单总结介绍了在 HD Prime 或者 HD Mobile 上测试薄样品涂层所对应的正确技术，测试过程使用的是 HDXRF®技术。

请参考右边相对应的图像：

- ① 首先刮掉涂层样品板上的一小块漆，露出下面的基底。要把涂层完全刮干净，刮掉的面积要足够大，保证测量头不会和任何涂层区域发生接触。
- ② 本图像显示的是样品板的反面。

对涂层进行测量：

- ③ 准备一个 Chemplex PROLENE 薄膜样品杯，然后将待测的涂层样品放在膜的顶部。这样可以确保来自样品下部的信号不会对结果造成干扰。（比如，如果样品的泡沫垫中含有杂质，就有可能干扰到测量结果。）将 HDXRF 分析器的测量头与选定的涂层区域接触，开始测量。

在测量进行到一半时，仪器将提示用户重新放置测量头到样品上没有涂层的区域。

- ④ 不要将样品的背面选为基底部分。如果在测量时使用了小于 1 毫米厚的金属样品，或者是小于 3 毫米厚的塑料、木材或纸板样品，那么就会检测到样品背面的涂层信号，导致涂层和基底的检测结果都出现错误。除了结果出现错误之外，用户也有可能收到一条错误信息“涂层测试结果有问题，请联系 XOS 寻求技术支持”
- ⑤ 不要使用样品的反面作为基底，直接将样品上的涂层除去一小块，露出基底即可。

结论

为了确保 HD Prime or HD 分析仪能得到最准确、最精密的结果，用户必须首先确保使用的是正确的测量技术。

如果在您使用 HDXRF 仪器时，某种样品的测量技术或测量结果有问题，请联系 XOS 技术支持以获得帮助。

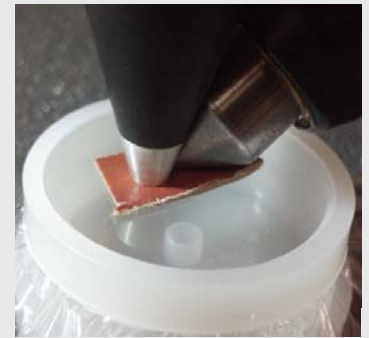
①



②



③



④



⑤

